

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
747-10**

QC 700000

1991

**AMENDEMENT 2
AMENDMENT 2**

1996-02

Amendement 2

Dispositifs à semiconducteurs

Dixième partie:
Spécification générique pour
les dispositifs discrets et les circuits intégrés

Amendment 2

Semiconductor devices

Part 10:
Generic specification for discrete devices
and integrated circuits

© CEI 1996 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
47/1389/FDIS	47/1391/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 66

Ajouter le nouveau paragraphe suivant:

4.2 Définitions d'un essai destructif

Un essai est considéré comme destructif s'il modifie les propriétés spécifiées ou l'apparence du dispositif essayé ou s'il contraind le dispositif de telle manière que sa qualité intrinsèque et/ou sa fiabilité opérationnelle soient susceptibles d'être réduites après l'essai.

En pratique, un tel essai est destructif:

- s'il est effectué à une valeur excédant une limite absolue du dispositif en essai, ou
- si le même essai ne peut être effectué à nouveau sur le même dispositif avec la même probabilité de succès que lors du premier essai effectué sur ce dispositif;

ou

- s'il y a un risque que, suite à l'essai, le dispositif essayé ne soit plus de qualité acceptable pour un utilisateur.

Renommer respectivement les 4.2 à 4.4 en 4.3 à 4.5.

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
47/1389/FDIS	47/1391/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

Page 67

Add the following new paragraph:

4.2 Definition of a destructive test

A test is considered to be destructive if it modifies the specified properties of appearance of the tested device or if it stresses the device in such a way that the intrinsic quality and/or the operational reliability of the device could be reduced after the test.

In practice, such a test is destructive:

- if it is performed at a value exceeding an absolute limiting value, or
- if the same test cannot be performed again on the same device with the same probability of success as before the first test was performed;

or

- if there is a possibility that, as a result of being subjected to the test, the tested device would no longer be of a quality acceptable to a user.

Renumber paragraphs 4.2 to 4.4 as 4.3 to 4.5, respectively.